

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

F. Silicon Device and Integration Technology 분과

Room I

루비3 (본관, 5층)

2013년 2월 5일(화) 10:55-12:10

[T12-F] 로직 소자 및 집적기술 II

좌장: 이희덕(충남대학교)

-
- | | | |
|---------|-------------|--|
| T12-F-1 | 10:55-11:25 | [초청] Advanced Logic Process Technology
이내인, 김우희, 이종호, 신동석, 조학주, 김동원, 정형석
삼성전자 System LSI 사업부 |
| T12-F-2 | 11:25-11:40 | First Experimental Demonstration of Junctionless SiGe PMOS FinFETs on n-type Bulk-Si
Tae Kyun Kim ¹ , Young Gwang Yoon ¹ , Jung Min Moon ¹ , Dong-Il Moon ¹ , Gi Seong Lee ² , Dong Wook Lee ² , Dong Eun Yoo ² , Hae Chul Hwang ² , Jin Soo Kim ² , Hyun Mook Jung ³ , Yang-Kyu Choi ¹ , Byung Jin Cho ¹ , and Seok-Hee Lee ¹
¹ Department of Electrical Engineering, KAIST, ² National Nanofab Center, ³ Jusung Engineering Co., Ltd. |
| T12-F-3 | 11:40-11:55 | FinFET with ONO BOX for Nonvolatile and Unified Memory
Sung-Jae Chang ¹ , Maryline Bawedin ² , Wade Xiong ³ , Jong-Hyun Lee ⁴ , Jung-Hee Lee ⁴ , and Sorin Cristoloveanu ¹
¹ IMEP-LAHC, Grenoble INP Minatec, ² IES, University of Montpellier, ³ AMD, Wilschdorfer Landstrasse, ⁴ Kyungpook National University |
| T12-F-4 | 11:55-12:10 | Temperature Effect on the Intrinsic Reliability of Hf_xAl_{1-x}O_y Dielectric
장경은 ¹ , 김진주 ² , 김민우 ² , 이상경 ¹ , 정옥진 ¹ , 김용훈 ¹ , 이영곤 ¹ , 이병훈 ^{1,2}
¹ 광주과학기술원 신소재공학부,
² 광주과학기술원 나노바이오 전자재료공학과 |